

L-Shape® FIB-SEM三次元解析装置 NX9000

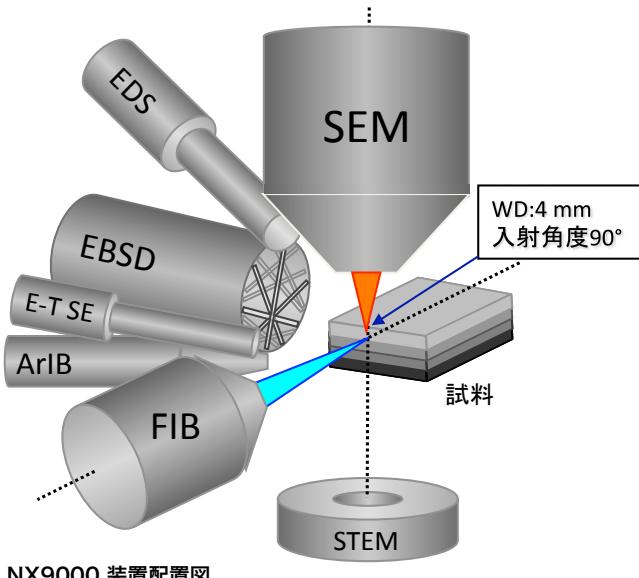
FIB と SEM を直角に配置した三次元解析用加工観察装置です。FIB-SEM、各検出系の最適配置により、高分解能三次元マルチ解析を行うことが出来ます。

主な特長

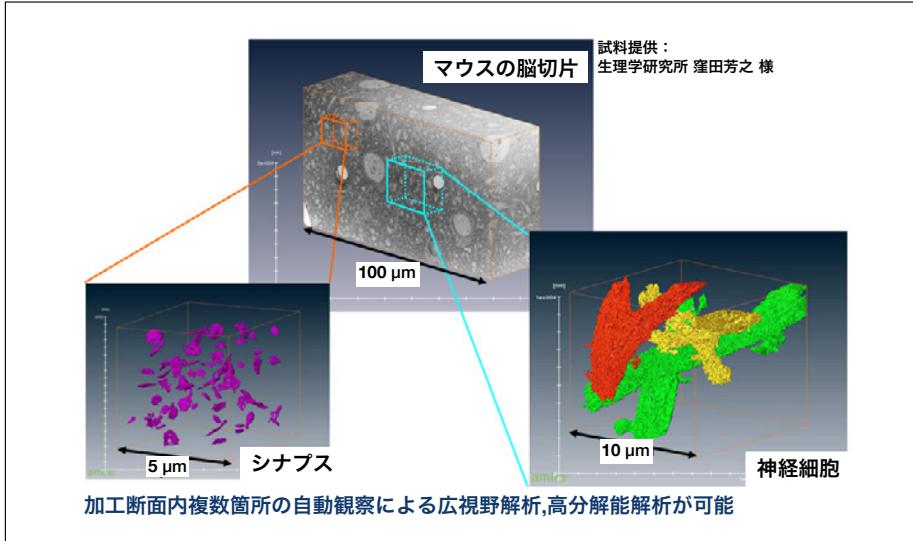
- (1) 新型 FIB 及び新型 SEM 鏡筒の搭載により、高速高細密加工と高分解能観察が可能です。
- (2) マルチ Cut&See 機能により、加工断面内複数箇所の観察像を連続自動取得することができ、広視野解析と高分解能解析を両立できます。
- (3) 日立製 TEM 用多軸・環境型ホルダが搭載でき、装置間リンクや様々な試料への対応が可能です。

※L-Shape® は株式会社日立ハイテクサイエンスの日本での登録商標です。

ビームや検出器の最適による三次元マルチ解析が可能



NX9000 装置配置図



マルチCut&See機能による生体試料の三次元観察期